

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b>          | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion G – Physik</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>G01</b>        | <b>Klasse</b>       | <b>Messen; Prüfen</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>G01Q</b>       | <b>Unterklasse</b>  | <b>Rastersondentechniken oder Vorrichtungen hierfür; Anwendung von Rastersondentechniken, z.B. Rastersondenmikroskopie [Scanning-Probe Microscopy = SPM] [2010.01]</b>                      |
| <b>G01Q 10/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Abtastanordnungen oder Positionieranordnungen, d.h. Anordnungen zur aktiven Steuerung der Bewegung oder der Position der Sonde [2010.01]</b>                                             |
| G01Q 10/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Grobes Abtasten (Scannen) oder Positionieren [2010.01]                                                                                                                                    |
| G01Q 10/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Feines Abtasten (Scannen) oder Positionieren [2010.01]                                                                                                                                    |
| G01Q 10/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schaltungen oder Algorithmen hierfür [2010.01]                                                                                                                                          |
| <b>G01Q 20/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Überwachung der Bewegung oder der Position der Sonde [2010.01]</b>                                                                                                                       |
| G01Q 20/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch optische Mittel [2010.01]                                                                                                                                                           |
| G01Q 20/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Selbst-detektierende Sonden, d.h. die Sonde selbst erzeugt ein für ihre Position repräsentatives Signal, z.B. piezoelektrische Sensoren [2010.01]                                         |
| <b>G01Q 30/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Hilfsmittel zur Unterstützung oder Verbesserung von Rastersondentechniken oder Rastersondenvorrichtungen, z.B. Anzeige- oder Datenverarbeitungseinrichtungen [2010.01]</b>               |
| G01Q 30/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Nicht-SPM Analyseeinrichtungen, z.B. Rasterelektronenmikroskope [Scanning Electron Microscope = SEM], Spektrometer oder optische Mikroskope [2010.01]                                     |
| G01Q 30/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Anzeige- oder Datenverarbeitungseinrichtungen [2010.01]                                                                                                                                   |
| G01Q 30/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Fehlerkompensation [2010.01]                                                                                                                                                        |
| G01Q 30/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Schaffen oder Einstellen einer gewünschten Umgebungsbedingung innerhalb einer Probenkammer [2010.01]                                                                           |
| G01Q 30/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . thermische Umgebung [2010.01]                                                                                                                                                           |
| G01Q 30/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . fluide Umgebung [2010.01]                                                                                                                                                               |
| G01Q 30/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . flüssige Umgebung [2010.01]                                                                                                                                                           |
| G01Q 30/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vakuumumgebung [2010.01]                                                                                                                                                                |
| G01Q 30/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Schützen oder Isolieren des Inneren einer Probenkammer vor äußeren Umgebungsbedingungen oder Umgebungseinflüssen, z.B. Schwingungen oder elektromagnetischen Feldern [2010.01] |
| G01Q 30/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen oder Verfahren für die Probenhandhabung [2010.01]                                                                                                                           |
| <b>G01Q 40/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kalibrierung, z.B. von Sonden [2010.01]</b>                                                                                                                                              |
| G01Q 40/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Kalibrierstandards und Verfahren zu deren Herstellung [2010.01]                                                                                                                           |
| <b>G01Q 60/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Besondere Arten der Rastersondenmikroskopie [SPM] oder Vorrichtungen hierfür; wesentliche Bestandteile hiervon [2010.01]</b>                                                             |
| G01Q 60/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Kombinierte SPM-Methoden, die zwei oder mehr SPM-Techniken umfassen [2010.01]                                                                                                             |
| G01Q 60/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rastertunnel-Mikroskopie [Scanning Tunnelling Microscopy = STM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01]                                           |
| G01Q 60/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . optische Rasternahfeldmikroskopie [Scanning Near-field Optical Microscopy = SNOM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01]                         |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G01Q 60/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Magnetkraftmikroskopie [Magnetic Force Microscopy = MFM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01]                                                     |
| G01Q 60/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Rastertunnel-Mikroskopie [Scanning Tunnelling Microscopy = STM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. STM-Sonden [2010.01]                                                                         |
| G01Q 60/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rastertunnel-Spektroskopie [Scanning Tunnelling Spectroscopy = STS] [2010.01]                                                                                                              |
| G01Q 60/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rastertunnel-Potentiometrie [Scanning Tunnelling Potentiometry = STP] [2010.01]                                                                                                            |
| G01Q 60/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]                                                                                                                |
| G01Q 60/18        | 1-Punkt Untergruppe | . optische Rasternahfeldmikroskopie [Scanning Near-Field Optical Microscopy = SNOM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SNOM-Sonden [2010.01]                                                      |
| G01Q 60/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Fluoreszenz [2010.01]                                                                                                                                                                      |
| G01Q 60/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]                                                                                                                |
| G01Q 60/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. AFM-Sonden [2010.01]                                                                                        |
| G01Q 60/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . Reibungskraft-Mikroskopie [2010.01]                                                                                                                                                        |
| G01Q 60/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . Adhäsionskraft-Mikroskopie [2010.01]                                                                                                                                                       |
| G01Q 60/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Potential-Rastermikroskopie [2010.01]                                                                                                                                                      |
| G01Q 60/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . AC-Modus [2010.01]                                                                                                                                                                         |
| G01Q 60/34        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Tapping-Modus [2010.01]                                                                                                                                                                  |
| G01Q 60/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . DC-Modus [2010.01]                                                                                                                                                                         |
| G01Q 60/38        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]                                                                                                                |
| G01Q 60/40        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Leitfähige Sonden [2010.01]                                                                                                                                                              |
| G01Q 60/42        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Funktionalisierung [2010.01]                                                                                                                                                             |
| G01Q 60/44        | 1-Punkt Untergruppe | . Ionenleitfähigkeits-Rastermikroskopie [Scanning Ion-Conductance Microscopy = SICM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SICM-Sonden [2010.01]                                                     |
| G01Q 60/46        | 1-Punkt Untergruppe | . Kapazitätsrastermikroskopie [Scanning Capacitance Microscopy = SCM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SCM-Sonden [2010.01]                                                                     |
| G01Q 60/48        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]                                                                                                                |
| G01Q 60/50        | 1-Punkt Untergruppe | . Magnetkraftmikroskopie [Magnetic Force Microscopy = MFM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. MFM-Sonden [2010.01]                                                                                |
| G01Q 60/52        | 2-Punkt Untergruppe | . . Resonanz [2010.01]                                                                                                                                                                         |
| G01Q 60/54        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01]                                                                                                                |
| G01Q 60/56        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Sonden mit magnetischer Beschichtung [2010.01]                                                                                                                                           |
| G01Q 60/58        | 1-Punkt Untergruppe | . thermische Rastermikroskopie [Scanning Thermal Microscopy = SThM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SThM-Sonden [2010.01]                                                                      |
| G01Q 60/60        | 1-Punkt Untergruppe | . elektrochemische Rastermikroskopie [Scanning Electro-Chemical Microscopy = SECM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SECM-Sonden [2010.01]                                                       |
| <b>G01Q 70/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Allgemeine Aspekte zu SPM-Sonden, deren Herstellung und zugehörigen Geräten, sofern sie nicht besonders für eine einzelne der SPM-Techniken unter G01Q 60/00 ausgebildet sind [2010.01]</b> |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G01Q 70/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Sondenhalterungen [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G01Q 70/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kompensation für temperatur- oder schwingungsinduzierte Fehler [2010.01]                                                                                                                                                                                                                         |
| G01Q 70/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Arrays von Sondenspitzen [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G01Q 70/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Sondencharakteristik [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G01Q 70/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Form und Konizität [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G01Q 70/12        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Nanoröhrchen-Spitzen [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G01Q 70/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . besondere Materialien [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G01Q 70/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Sondenherstellung [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G01Q 70/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Funktionalisierung [2010.01]                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>G01Q 80/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anwendungen von anderen Rastersondentechniken als SPM (Herstellung oder Behandlung von Mikrostrukturen B81C; Herstellung oder Behandlung von Nanostrukturen B82B 3/00; Aufzeichnen oder Wiedergabe von Information mittels Nahfeldwechselwirkung G11B 9/12, G11B 11/24 oder G11B 13/08) [2010.01]</b> |
| <b>G01Q 90/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Rastersondentechniken und Rastersondenvorrichtungen soweit nicht anderweitig vorgesehen [2010.01]</b>                                                                                                                                                                                                 |